

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации
топологии интегральной микросхемы

№ 2008630043

**Топология тестовых структур для экспериментальной проверки
базовой технологии изготовления радиационностойких
СБИС на КНИ структурах**

Правообладатель(ли): *Государственное учреждение
«Научно-производственный комплекс «Технологический
центр» Московского государственного института
электронной техники» (RU)*

Автор(ы): *Басаева Татьяна Сергеевна, Коняхин Валерий
Вячеславович, Кузнецов Евгений Васильевич (RU)*

Заявка № **2008630030**

Дата поступления **17 июля 2008 г.**

Зарегистрировано в Реестре топологий
интегральных микросхем **12 сентября 2008 г.**

Дата начала срока действия исключительного права
12 сентября 2008 г.

*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам*

Б.П. Симонов

